

TEZ ÖZETLERİNİN HAZIRLANMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yayın ve Dökümantasyon Merkezi'ne Gönderilmek Üzere Tez Özetlerinin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Kurallar:

Tez Özetleri Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlanmalı.

A 4 boyutundaki kağıda 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 12 puntoluk harf ile yazılmalı, italik harfler kullanılmamalı.

Özet yazımında LAZER yazıcılardan yararlanılmalı, yazı koyu (bold) olmalıdır.

Özet sayfası kesinlikle katlanmamalı, naylon dosya göleği içinde Enstitü'ye teslim edilmelidir.

İlişikte bir örneği verilen "Tez Veri Giriş Formu"nun da tezi hazırlayan kişi tarafından bilgisayar yada daktilo ile doldurularak Enstitü'ye teslim edilmelidir.

2- Fen Bilimleri Enstitüsü'ne Teslim Edilecek Tez Özetleri ile İlgili Esaslar:

Tez özetleri PC uyumlu bir bilgisayar ortamında, Microsoft Word 2000 yada daha ileri bir versiyon programında Times New Roman fontu ve 12 punto kullanarak aşağıdaki esaslara göre İNGİLİZCE ve TÜRKÇE hazırlanıp bir diskette enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

TEZİN BAŞLIĞI (büyük harflerle ve kalın)

SOYADI (büyük harflerle ve kalın), Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Program, Yönetici: (Ünvanı, Adı Soyadı), Ortak Yönetici (VARSA, Ünvanı Adı Soyadı), Sayfa Sayısı, Tarih (ay, yıl)

ÖZET (maksimum 250 kelime)

Anahtar kelimeler (5 anahtar kelime):

TITLE OF THESIS

SURNAME (with capital letters and bold) First name, M.S/Ph.D, Program, Supervisor:(Title, First Name, Surname), Co-advisor (IF PRESENT, Title, First Name, Surname), Number of pages, Date (Month, Year)

ABSTRACT(maximum 250 words)

Keywords (5 keywords):

X-IŞINI SPEKTROMETRESİ İLE KALINLIK TAYİNİ

EKİNCİ Neslihan, Yüksek Lisans Tezi, Yönetici: Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, 52s., Eylül 1996

Bu tez çalışmasında, muhtelif kalınlıklı Al, Ag, Au levha numunelerin kalınlıkları x-ışını geçiş (transmission) tekniği kullanılarak spektrometrik metotla deneysel olarak bulunmuştur.

Radyoaktif Am-241 nokta ve halka kaynaklarından yayınlanan 59.5 keV'lik gama fotonları uygun geometrilerde muhtelif kalınlıklı numuneler üzerine düşürülerek, numuneden geçen, saçılan ve yayınlanan karakteristik fotonların spektrumları ayrı ayrı elde edilmiştir. Havadan ve numune tutucularından saçılma ve temel sayma (background) katkısını tayin etmek için numunesiz ölçüler alınmıştır.

Bu ölçümlerde, 5.9 keV'de yarı maksimumdaki tam genişliği 160 eV olan bir Si(Li) dedektörü ile bağlantılı olan ND 66B çok kanallı analizör ve diğer elektronik sistemler kullanılmıştır. Spektrometrik olarak bulunan kalınlıkların şiddete, mikrometre ve tartma yoluyla bulunan kalınlıklara karşı korelasyon grafikleri çizilmiştir. Bu grafiklerden, bunlar arasında iyi bir korelasyon olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: X-ışını geçiş (transmission) tekniği, ince film kalınlığı, enerji ayırmalı x-ışını flöresans

DETERMINATION OF THE SAMPLE THICKNESS BY X-RAY SPECTROMETER

EKİNCİ Neslihan, MS, Supervisor: Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, 52s., September 1996

The thicknesses of the various foils of Al, Ag, Au have been determined with the transmission technique using an energy dispersive x-ray spectrometer. The samples with various thickness are bombarded with the gamma rays emitted from the Am-241 point and annular sources at suitable experimental geometries. The transmitted, scattered and characteristic photons are acquired separately.

To determine the contributions of the background and scatterings from the sample holder and weather, the measurement without sample have been performed. To acquire the spectra, a Si(Li) detector with full width at half maximum (FWHM) is 160 eV at 5.9 keV coupled to an ND 66B multichannel analyser and the other electronical systems were used. The thicknesses experimentally determined with the transmission technique have been plotted versus intensity, thicknesses determined gravimetrically and measured with a micrometer. It is seen from these plots that there are good correlations between the spectrometrically measured thickness and intensity, the thicknesses determined by gravimetric method and directly measured by a micrometer.

Keywords: Transmission method, thin film thickness, energy dispersive x-ray fluorescence spectrometry